UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

ATLab
Automatic Testing Laboratory

col Patrocinio del Corso di Dottorato
in Fisica e Astronomia

National Ph. D. in Micro and Nano Electronics

TECHNOPROBE

1st WORKSHOP on
ELECTRONIC DEVICE AUTOMATIC TESTING

16 November, 2026, University of Milan-Bicocca
Aula Sironi – Piazza della Scienza – U4 Building - Milan

Chairmen: D. Appello (Technoprobe), A. Baschirotto (U. Milan-Bicocca)

PROGRAM

08.00 Registration

09.00 Opening (**C. Riccardi** – Direttore Dip. di Fisica)

09.15 **C. Musca** (ANIE) "Bridging Innovation and Technological Sovereignty: The Strategic Role of Automatic Testing from Research to Market"

09.35 **F. Cavenaghi, M. Zegaoui**, "AI-Assisted Feasibility Analysis of Probe Cards for WBG Device Testing"

09.55 **A. Shah** (U. Milan-Bicocca), "Modeling ATE Test-Hardware for Pre-Silicon Validation in a SystemC-AMS Virtual Testing Framework"

10.15 **C. Bertani** (STMicroelectronics), "Finding the Sweet Spot: Test & Stress Optimization for complex automotive MCUs"

10.35 **D. Turossi** (Infineon), "Challenges and solutions for High Voltage/Current ATE testing of Gate Drivers"

11.00 Coffee break

11.20 **R. Massolini** (Marvell),
F. Pizza (Advantest)
"HW Design to Silicon Insights: Tester based Validation & Characterization opportunity»

12.00 **G. Iaria** (PoliTorino), "TestYard: Open-Source Benchmarks from Chipyard framework for VLSI hardware testing"

12.20 **M. Strazzeri** (Inventvm), "From Silicon Validation to Mass Production: a unified Testing Strategy"

12.40 Lunch break

14.00 **G. Saracco** (Cosmic), "Rethinking Semiconductor Testing: A UX-Based Test Operating System Powered by AI"

14.20 **A.I. Melloni** (PoliMilano), "Tools and techniques for photonic testing"

14.40 **A. Ressia** (Synopsys) "Automating validation in high-speed Serdes"

15.00 Panel

16.00 – Conclusions

All the presentations will be given in Italian

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

ATLab
Automatic Testing Laboratory

col Patrocinio del Corso di Dottorato
in Fisica e Astronomia

National Ph. D. in Micro and Nano Electronics

TECHNOPROBE

1st WORKSHOP on
ELECTRONIC DEVICE AUTOMATIC TESTING

16 November,, 2026, University of Milan-Bicocca

Aula Sironi – Piazza della Scienza - U3 Building - Milan

La Lombardia e l'Italia costituiscono un polo strategico di rilevanza internazionale nella progettazione e nello sviluppo dei circuiti integrati. In questo panorama di eccellenza, il **Testing Automatico** rappresenta un passaggio cruciale e imprescindibile per assicurare standard elevati di qualità, affidabilità e sostenibilità nella produzione delle tecnologie elettroniche di nuova generazione.

Per rispondere con efficacia alle dinamiche di un settore in rapida evoluzione, l'**Università di Milano-Bicocca** e **Technoprobe** sono liete di presentare la prima edizione del **Workshop sul Testing Automatico di Circuiti Integrati**, mirato a promuovere una maggiore strutturazione del settore per stimolare l'innovazione e facilitare il trasferimento tecnologico.

Trattandosi di un'**iniziativa a carattere nazionale**, il Workshop nasce con l'obiettivo primario di **creare un network italiano coordinato tra gli esperti del settore**. Questa rete integrata permetterà fin da subito una maggiore efficienza operativa, ponendo al contempo le basi per presentarsi in modo più forte, coeso e strutturato all'interno del panorama internazionale.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno modo di:

- **Incontrare alcuni tra i principali protagonisti italiani** del settore della ricerca e dell'industria;
- **Presentare le attività e i progetti in corso**, condividendo metodologie avanzate e tecnologie all'avanguardia;
- **Favorire interazioni e collaborazioni strategiche** per avvantaggiare i singoli attori e dare nuovo impulso e competitività all'intero comparto.

L'evento si inserisce nel quadro strategico delineato dalla recente costituzione dell'**ATLab (Automatic Testing Laboratory)** presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'ATLab nasce con la missione di fungere da ponte solido tra formazione, ricerca e mondo del lavoro attraverso tre pilastri fondamentali:

- **Ricerca scientifica**, con lo sviluppo di progetti di ricerca innovativi;
- **Formazione specialistica**, mediante corsi dedicati e tesi di laurea e di dottorato di ricerca;
- **Disseminazione**, con la promozione di eventi pubblici e momenti di confronto come questo WS.

In tale prospettiva di crescita, a partire dall'Anno Accademico 2027/28 l'Ateneo integrerà all'interno di un insegnamento universitario un modulo incentrato sul **Testing Automatico**, avviando la preparazione di figure professionali qualificate e rispondenti alle esigenze del mercato.

L'obiettivo è rendere il Workshop un appuntamento annuale di riferimento per la comunità italiana, sperando di coinvolgere nuovi partner e realtà del settore nella sua organizzazione. Questa sinergia amplierà la portata dell'evento e porrà le basi per iniziative di respiro internazionale negli anni a venire.

In questa prospettiva, gli organizzatori sono già attivi per candidare questa stessa sede ad ospitare nel uno dei più importante eventi del settore a livello europeo: un traguardo ambizioso per il quale sarà indispensabile il pieno sostegno e la collaborazione attiva di tutta la comunità italiana, coesa e sinergica. Sarà un'opportunità straordinaria che fungerà da vetrina per l'eccellenza italiana, fondamentale per proiettare il nostro settore verso nuovi prestigiosi traguardi.

L'evento è aperto a ricercatori, professionisti del settore, aziende ed esperti interessati al futuro del Testing Automatico. La registrazione è gratuita ma obbligatoria al sito

https://www.mbtechnoservices.com/ATLab_WS26/ATLab_WS26.html

*Per i **dottorandi partecipanti** sarà possibile sostenere un esame finale per l'eventuale acquisizione dei **CFU***